

电子所“CAS-DIS数字电离层测高仪”通过科技成果鉴定

文章来源：电子学研究所

发布时间：2014-03-26

【字号：小 中 大】

3月18日，中国科学院电子研究所研发的“CAS-DIS数字电离层测高仪”通过中国电子学会组织的科技成果鉴定。电子所党委书记、副所长孙殿义出席会议并发表了欢迎致辞。会议成立了鉴定委员会，委员来自工业与信息化部科技司和规划司、国家气象局、总参气象局、国家地震局、北京理工大学、清华大学、北京大学、中科院地质与地球物理研究所、空间中心等11位专家组成，委员会主任由毛二可院士担任，副主任由万卫星院士担任。

鉴定委员会听取了课题组做的研制技术总结报告、查新报告、用户报告、测试报告、经济效益和社会效益报告，并实地观看了电离层测高仪的工作过程。鉴定委员会经过充分的质疑和讨论，形成了鉴定意见。鉴定认为：“CAS-DIS数字电离层测高仪”实现了多项技术创新，处于国内领先，达到国际同类产品的先进水平，其中实时窄带跟踪滤波、全数字化圆极化波生成及O波和X波分离等技术优于国外产品。

CAS-DIS数字电离层测高仪成果已经成功应用于我国气象监测与灾害预警工程建设，多个电离层测高仪站已实现3年多的稳定业务运行，为中国气象局国家卫星气象中心开展空间天气灾害监测预警业务工作提供了可靠的数据源保障，产生了显著的经济与社会效益。电子所将进一步加大CAS-DIS数字电离层测高仪的市场应用推广工作。



鉴定会现场

打印本页

关闭本页